СТРУКТУРА, СУБСТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ИОННО-ПЛАЗМЕННЫХ КОНДЕНСАТОВ КВАЗИБИНАРНОЙ КАРБИДНОЙ СИСТЕМЫ WC-TiC.

О.В. Соболь

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" Украина

Поступила в редакцию 18.06.2007

Методами широкоугловой рентгеновской дифрактометрии в сочетании с рентгенфлюоресцентным спектральным анализом изучено влияние состава распыляемого материала и температуры осаждения на фазовый и элементный составы, структуру, субструктурные характеристики и напряженное состояние ионно-плазменных конденсатов квазибинарной системы WC-TiC.

введение

Фазовые переходы позволяют при неизменной или практически неизменной средней концентрации элементов добиться существенного изменения функциональных свойств материала. В случае условий, близких к равновесным, к фазовым переходам могут приводить изменения макропараметров системы, таких, например, как температура и давление. В сильно неравновесных системах фазовые переходы могут быть инициированы действием не только макропараметров, но и могут происходить в результате проявления флуктуационной неоднородности на микро- и нано- уровнях, например, при концентрационном расслоении. Вследствие чего для материалов в метастабильном состоянии это приводит к достижению гораздо более широкого спектра возможных фазовых составов и структурных состояний. К таким материалам относятся нанокристаллические конденсаты, полученные осаждением из ионно-плазменных потоков, например, формируемые с использованием метода ионного распыления. В этом случае еще одной из особенностей структурного состояния материала конденсата является образование при его формировании высокой плотности неравновесных вакансий [1 - 3].

Особенно большой спектр различных фазовых составов и структурных состояний следует ожидать при конденсации твердых растворов, образующихся на основе квазибинарных систем боридов, карбидов или нитридов переходных металлов с сильно разнящимся электронным строением. К таким переходным металлам относится пара: титан – вольфрам, которая позволяет достигнуть наиболее сильного различия по их химической активности к неметаллическим атомам (титан расположен в 4-й группе и 4-м периоде, а вольфрам в 6-й группе и 6-м периоде системы элементов). Кроме того, большое различие по массам и соответственно рассеивающей способности Ті и W атомов обеспечивает для этой системы высокую выявляемость различных структурных изменений при использовании для этого рентгендифракционных методов [4].

Структура на основе относительно простой кубической гранецентрированной решетки и высокие функциональные характеристики исходных составляющих, делает квазибинарную систему WC-TiC весьма перспективной для ее промышленного использования. Кроме того, простая решетка свойственная как отдельным компонентам этой системы так и твердому раствору в конденсированном состоянии [5], позволяет достаточно в полной мере охарактеризовать процессы, выявляемые по результатам исследований широкоугловой рентгеновской дифрактометрии.

Поэтому целью данной работы было на примере квазибинарной системы WC-TiC с кубической решеткой рассмотреть закономерности формирования фазового состава, структуры, напряженного состояния и их эволюцию при различной температуре осаждения нанокристаллических ионно-плазменных конденсатов.

Образцы были получены ионным распылением (магнетронная схема), при распылении горячепрессованных мишеней с различным объемным содержанием входящих в них WC и TiC составляющих: 1-я мишень имела средний состав – 31 мол.% TiC – 69 мол.% WC, 2-я мишень – 21 мол.% TiC – 79 мол.% WC и 3-я мишень – 15 мол.% ТіС – 85 мол.% WC. Для распыления использовалась планарная магнетронная схема ионного распыления. Распыление осуществлялось в среде инертного газа Ar при давлении 2 – 3 мТорр. Подаваемое распыляющее напряжение составляло 320 – 400В, что обеспечивало скорость конденсации ≈0,5нм/с. В качестве подложек использовались: алюминиевая и бериллиевая катанные фольги толщиной 15 мкм, подложка из шлифованного никеля толщиной 400 мкм и полированные подложки из монокристаллического кремния и ситалла толщиной 380 и 350 мкм, соответственно.

Исследование фазового состава, структуры, субструктурных характеристик (размер кристаллических областей когеррентного рассеяния – кристаллитов и величина микродеформации) и напряженного состояния конденсатов осуществлялось методом широкоугловой рентгеновской дифракции на рентгеновском дифрактометре ДРОН-3 в излучении Сu-K_α по стандартной методике [3, 5]. Для детальных рентгендифракционных исследований в качестве основных объектов использовались пленки на подложках из кремния и бериллия, а для отдельных сравнительных исследований – алюминиевая, никелевая и ситалловая подложки.

Исследование элементного состава проводилось методом рентгенфлуоресцентного спектрального анализа на установке СПРУТ-2 (производства АО "Укррентген", Украина). Возбуждающее излучение задавалось рентгеновской трубкой с серебряным анодом.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенный методом рентгеновской флуоресцентной спектроскопии анализ элементного состава показал, что соотношение Ti/W металлических атомов в покрытиях при температуре конденсации, не превышающей 500 °C, остается практически неизменным и близким к составу мишени (рис. 1). При более высокой температуре конденсации отношение более легких титановых атомов к более тяжелым вольфрамовым атомам в конденсате уменьшается.



Рис. 1. Зависимость элементного состава от температуры осаждения для ионно-плазменных конденсатов полученных распылением 3-х мишеней с разными составами (стрелками слева указано соотношение Ti/W металлических атомов в мишени).

Характерной особенностью структурного состояния конденсатов, полученных как при относительно низкой (близкой к комнатной) температуре конденсации, так и при сравнительно большой температуре конденсации (до 750 °C) в широком интервале исследуемых составов (рис. 1), является формирование однофазного твердого раствора (W, Ti)C [6] с нанокристаллической структурой [7].

Причем, при низкой температуре конденсации 80 – 250 °С происходит формирование практически однотипного структурного состояния на всех используемых в работе подложках (рис. 2).

При более высокой температуре осаждения, начиная с 300 °С, на гладких шлифованных подложках из никеля и полированных подложках из ситалла и кремния наблюдалось формирование преимущественно ориентированных кристаллитов с осью (100) перпендикулярной плоскости роста. При этом на шероховатой (с высотой неоднородности $R_z \approx 1$ мкм) бериллиевой и алюминиевой подложках эффект преимущественной ориентации растущих кристаллитов не наблюдался.



Рис. 2. Участки дифракционных спектров конденсатов, полученных распылением мишени состава 15 мол.% TiC – 85 мол.% WC. Температура осаждения 80 °C, подложки: 1 – алюминиевая фольга; 2 – бериллий; 3 – полированный монокристаллический кремний.

Степень совершенства текстуры (100), определенная при ψ-сканировании [8], изменялась немонотонно. При температуре осаждения 600 – 700 °С наблюдается резкое уменьшение полуширины дифракционной линии при ψ-сканировании, что свидетельствует об уменьшении угловой разориентации кристаллитов относительно оси текстуры (100) (рис. 3).



Рис. 3. Изменение степени совершенства текстуры (100) в конденсатах толщиной 1 мкм осажденных на кремниевую подложку при распылении мишени третьего состава.

Причем интересной особенностью было то, что при увеличении толщины покрытия совершенство текстуры повышалось (на рис. 3 приведены данные для конденсатов толщиной ≈1 мкм и для сравнения результаты для конденсата толщиной 0,5 мкм). Кроме того следует отметить, что при $T_{\text{конд}}$ более 830 °C (при распылении 3-й мишени) и более 900 °C (при распылении 2-й мишени) нарушалась однофазность конденсируемого материала, и пик, соответствующий (W, Ti)C – твердому раствору, распадался на два субпика, соответствующих WC и TiC составляющим (рис. 4).



Рис. 4. Участки дифракционных спектров конденсата, полученных при распылении мишени 2-го состава и осажденные на кремниевую подложку при температуре конденсации 700° (1), 850° (2), и 950 °C (3). Отражения от плоскости (331) сняты при $\psi = 46,5$, а от (420) при $\psi = 26,5$.

В качестве характерных, на рис. 4 представлены отражения от плоскостей (331) и (420) твердого раствора до и после распада на WC и TiC составляющие. Конденсаты твердого раствора в этом случае были получены при распылении мишени 2-го состава: 21 мол.% TiC – 79 мол.%WC.

Изучение кинетики изменения фазового состава при изменении соотношения металлических атомов Ті/W в распыляемой мише-



Рис. 5. Участки дифракционных спектров конденсатов, полученных распылением мишеней разных составов: a) –31 мол.% TiC – 69 мол.% WC (T_{κ} = 250 °C (1), 560 °C (2), 850 °C (3), 900 °C (4), 950 °C (5)), 6) – 21 мол.% TiC – 79 мол.% WC (T_{κ} = 80 °C (1), 300 °C (2), 700 °C (3), 850 °C (4), 950 °C (5)), в) – 15 мол.% TiC – 85 мол.% WC (T_{κ} = 80 °C (1), 700 °C (2), 750 °C (3), 850 °C (4)), г) – 15 мол.% TiC – 85 мол.% WC (T_{κ} = 850 °C).

ни и варьировании в пределах 80 – 900 °C температуры подложки при конденсации показало (рис. 5), что при относительно высокой концентрации атомов титана в распыляемой мишени 1-го состава однофазность конденсатов твердого раствора сохраняется до наивысшей из исследуемых температур осаждения 950 °C (рис. 5а). В тоже время, при распылении мишеней с меньшим содержанием титановых атомов (мишени 2 и 3) максимальная температура, при которой формировался еще однофазный конденсат твердого раствора не превышала 750 °C (рис. 5б, в). При более высокой температуре 800 – 850 °C в конденсатах, полученных распылением мишени второго состава появляются дифракционные линии W_2 С-фазы с ГПУ решеткой (рис. 5б) и линии α -W фазы. Еще более выражено (что свидетельствует о большем их объемном содержании) образование кристаллитов W_2 С и α -W фаз при температуре осаждения 850 °С проявляется в конденсатах, полученных распылением мишени третьего состава с наименьшим удельным содержанием атомов Ті (рис. 5в, г). Видно, что в этом случае преимущественно происходит образование кристаллитов α -W фазы, а также WC и ТіС карбидов, как результат распада (W,Ti)С твердого раствора (рис. 5г).

Таким образом, при малом содержании атомов титана, в процессе высокотемпературного осаждения происходит формирование кристаллитов трех основных фаз: монокарбидов титана и вольфрама, а также α -W с ОЦК-решеткой. В равновесных условиях подобная реакция формирования низшего карбида вольфрама (W_2 С) и его распад на практически чистый α -W и монокарбид вольфрама (WC) происходит при недостатке по углероду при температуре 1255 °C [9], что значительно выше используемой температуры подложки при конденсации.

Известно, что формирование фаз с меньшим содержанием углеродных атомов по сравнению с исходным монокарбидом осуществляется путем образования упорядоченной вакансионной подсистемы в углеродной подрешетке (100), а, соответственно, предварительного образовании в ней недостатка по углеродным атомам. Как видно из рис. 3, 5, такой процесс наиболее интенсивно протекает в текстурированных конденсатах с осью (100), осажденных на гладкую поверхность, например из кремния, на которой достаточно высокой является подвижность осажденных атомов, а угол рассеяния при столкновении осаждаемых атомов с поверхностью, достаточно мал. Таким образом, планарность осаждаемого покрытия и высокая подвижность углеродных атомов при конденсации при температуре выше 700 °С приводит к их интенсивному реиспарению и уходу из области осаждения конденсата. Наиболее выражено этот процесс проходит в обогащенных атомами вольфрама областях, в которых обеднение по углероду проходит вплоть до образования кристаллитов, сильная металлическая связь в которых стимулирует формирование, свойственной для чистого вольфрама кубической ОЦК решетки.

Тот факт, что в результате распада твердых растворов (Ti, W)C с недостатком по углероду формируются кристаллиты монокарбида титана, а помимо монокарбида вольфрама формируются еще и низший по углероду карбид вольфрама и вольфрам – свидетельствует о большей прочности связей Ti-C в сравнении с W-C. Это предположение находится в хорошем согласии с диаграммой состояния системы Ti-W-C: твердый раствор (Ti,W)C, не насыщенный по углероду, распадается на две фазы – W и (Ti,W)C, а не на два простых карбида [9].

Действительно, вследствие высокого вклада d(W-W)-металлической связи, связь W-C значительно слабее связи Ti-C (100), что и является причиной преимущественного обезуглероживания и формирования обогащенных вольфрамовыми атомами областей. В этом случае в соответствии с реакцией: WC + O₂ \rightarrow W + CO₂ выигрыш свободной энергии составляет $\Delta H_{900K} = -435$ кДж/моль [11]. Образующийся в результате этой реакции легколетучий CO₂ удаляется из области конденсации при непрерывной вакуумной откачке.

В качестве основных причин приводящих к формированию низших карбидов и распаду (W, Ti)C-твердого раствора на WC и TiC составляющие помимо высокой подвижности атомов, стимулированной наличием вакансионной подсистемы в металлической и неметаллической подрешетках, может выступать и развитие конденсационных напряжений [12].

Определенный методом многократных наклонных съемок при температуре конденсации 80 °С и хорошей адгезии к кремниевой подложке макродеформация конденсата оказалась достаточно высокой сжимающей (определенная из "a" – "sin² ψ " – графика величина сжимающей деформации $\varepsilon \approx -1.6\%$, что близко к величине критической для ионноплазменных конденсатов карбидов [13]).

Наличие достаточно совершенной текстуры ($\Delta \psi < 15^{\circ}$ (рис. 3)) при температуре конденсации превышающей 600 °С, приводит к необходимости определения напряженнодеформированного состояния съемки отражений (331), (420), (422), (511) и (333) под соответствующими кристаллографическими углами 46,5; 26,5; 35,3; 15,7 и 54,7° по отношению нормали к плоскости (100) [5]. Учитывая, что в ГЦК решетке к смещению линий может приводить не только макродеформация и ориентированная микродеформация, но и образование дефектов упаковки, характерное, например, для конденсатов карбида вольфрама осажденных при высокой температуре [14], для построения "a"—"sin² ψ " – графика использовались не смещающиеся под действием дефектов упаковки отражения от плоскостей (333) и (422) или слабо смещающиеся – отражения от плоскости (511).

Результирующие значения величины макродеформации для разных составов и температуры конденсации приведены на рис. 6.



Рис. 6. Зависимость величины макродеформации от температуры осаждения на кремниевую подложку для конденсатов, полученных распылением мишеней разных составов: 1 – 31 мол.% TiC – 69 мол.%WC, 2 – 21 мол.%TiC – 79 мол.%WC и 3 – 15 мол.% TiC – 85 мол.%WC.

Видно, что при низкой температуре осаждении и относительно высоком содержании TiC составляющей в конденсатах развивается и остается не релаксированной высокая макродеформация. В тоже время, при высокой температуре конденсации, а также при малом содержании TiC величина макродеформации относительно низка и не превышает – 0,3%. При этом нелинейный характер зависимости в температурном интервале 750 – 900 °C обусловлен протеканием в этом температурном интервале процесса формирования полифазного материала (рис. 5б, в, г).

В конденсатах (W, Ti)C твердого раствора, осажденных на полированные никелевые подложки с высоким коэффициентом термического расширения ($\alpha_{Ni} \approx 17, 1 \cdot 10^{-6}$ град⁻¹) большая по величине конденсационная деформация сжатия ($-1,05 \div -1,4\%$) сохранялась в покрытии даже при высокой температуре осаждения 850–900 °C (при распылении мишеней 1-го и 2-го составов).

Известно, что основными факторами оказывающими влияние на конечное структурное состояние ионно-плазменного конденсата являются: разница коэффициентов термического расширения конденсата λ_к и подложки $\lambda_{n} (\Delta \lambda = (\lambda_{k} - \lambda_{n}))$ и конденсационная "atomic peening" – деформация, образуемая в результате бомбардировки растущего покрытия осаждаемыми частицами [15]. Считая, что величина "atomic peening" - деформации при больших толщинах конденсата слабо зависит от типа подложки, наблюдаемое в эксперименте отличие деформированного состояния конденсатов, нанесенных на Si и Ni подложки, можно объяснить различием $\Delta\lambda$. Оценки показывают, что в этом случае, полученные значения макродеформации могут иметь место при $\lambda_{s_i} \ll \lambda_{\kappa} \approx \lambda_{N_i}$.

Следует отметить, что величина макродеформации сжатия в конденсатах осажденных на шероховатые алюминиевую и бериллиевую подложки была меньшей и не превышала – 0,25%.

Использование двух порядков отражения от плоскостей для расчета субструктурных характеристик позволило определить не только влияние температуры конденсации на динамику изменения среднего размера кристаллитов, но и на развитие в них микродеформированного состояния.

На рис. 7 приведены результирующие зависимости для конденсатов, полученных распылением мишеней трех разных составов.

Следует отметить, что полученные для нанокристаллитов (W, Ti)С-твердого раствора субструктурные характеристики для конденсатов на бериллиевой подложке во всем температурном интервале соответствуют однофазным образцам (W, Ti)С-твердого раствора, в то время как при относительно низком содержании атомов Ті и температуре осаждения 850 °С на кремниевой подложке наблюдался распад твердого раствора и формирование помимо кристаллитов (W, Ti)С твердого раствора (или WC и TiC составляющих при распаде твердого раствора) кристаллитов низшей карбидной фазы на основе вольфрама (W₂C) или кристаллитов с ОЦК-решеткой присущей α-W фазе (рис. 5).



Как видно из рис. 7, при относительно низких температурах осаждения, при которых конденсаты однофазны, прослеживается характерное изменение субструктурных характеристик: размер областей когерентного рассеяния увеличивается с повышением температуры, а величина микродеформации уменьшается. Однако в интервале температур 700 - 900 °C, для которого характерны процессы образования предвыделений или выделения вторых фаз, наблюдается обратный ход зависимостей. В этой области вначале происходит увеличение микродеформации в кристаллитах твердого раствора, а средний размер самих кристаллитов уменьшается. Причем при высокой концентрации атомов титана, характерной для первой серии, а также при конденсации на берилливую шероховатую подложку, на которой процесс текстурообразования не проявляется вплоть до температуры 850 °С, увеличение размера кристаллитов наблюдается вплоть до самой высокой температуры



Рис. 7. Влияние температуры подложки при конденсации на субструктурные характеристики нанокристаллических конденсатов системы WC-TiC полученных распылением мишеней составов:

а) – 31мол.%ТіС – 69 мол.%WC (на подложке из кремния);

б) – 21 мол.%TiC – 79 мол.%WC (на подложке из кремния 1, 2 и бериллия 3, 4);

в) – 15 мол.%TiC – 85 мол.%WC (на подложке из кремния 1, 2 и бериллия 3, 4).

конденсации, а микродеформация в кристаллитах в температурном интервале 700 – 850 °С либо продолжает монотонно уменьшается, либо не сильно увеличивается (рис. 7).

С образованием многофазного материала покрытия на кремниевой подложке при высокой температуре осаждения 850 °С можно связать и наблюдаемые для этой температуры особенности субструктурных характеристик (W, Ti)С-твердого раствора или β-WC составляющей, заключающиеся в уменьшении среднего размера нанокристаллитов и повышении величины микродеформации. Для состава с наименьшим содержанием титановых атомов, полученного при распылении 3-й мишени, второй основной из фаз многофазного покрытия, помимо (W, Ti)С-твердого раствора, являлась α-W фаза (рис. 5в, г). При этом в формируемых кристаллитах α-W фазы наблюдалась сравнительно низкая величина микродеформации (0,08%), а средний размер α-W кристаллитов был меньшим, по

сравнению с кристаллитами (W,Ti)С твердого раствора и составлял в среднем 6 нм. Также надо отметить, что характерной особенностью изменения субструктурных характеристик при увеличении толщины (а, соответственно, и времени конденсации) образцов было увеличение среднего размера (W, Ti)С кристаллитов и понижение развивающейся в них микродеформации (см., например, рис. 7б).

Как следует из анализа структурного состояния конденсатов и его субструктурных характеристик, преимущественная ориентация кристаллитов в карбидных фазах после распада твердого раствора сохраняется, а кристаллиты металлической фазы α-W, образующиеся при уходе углерода являются неориентированными. Поэтому, при съемке с фокусировкой по Бреггу-Брентано, мы получаем спектр дифракционных линий, приведенный на рис. 5г. В этой связи можно предположить, что диффузия углеродных атомов при высокотемпературном формировании кристаллитов приводит к усилению металлической связи и носит разориентирующий характер для формируемых кристаллитов α-W-фазы.

выводы

Таким образом, в конденсатах, полученных ионным распылением мишени квазибинарного состава WC-TiC, в достаточно большом концентрационном интервале происходит формирование однофазного (W,Ti)С твердого раствора с кубической решеткой, присущей ТіС фазе. При относительно низкой температуре конденсации (менее 300 °C) вне зависимости от типа и шероховатости используемых для осаждения подложек заметного отличия в формируемой структуре не наблюдается. Отличие, связанное с появлением преимущественной ориентации растущих кристаллитов с осью текстуры (100) проявляется при осаждении на гладкую полированную подложку кремния (и аналогично ситалла и никеля) при температуре конденсации более 300 °C.

При температуре конденсации превышающей 850 °С и соотношении атомов в распыляемой мишени Ti/W $\leq 0,25$, развитие текстуры (100) сопровождается формированием вместо однофазного (W, Ti)C-твердого раствора, полифазного конденсата, в котором, наряду с кристаллитами твердого раствора, выявляются кристаллиты фаз: β -WC (с кубической решеткой типа NaCl), TiC (с кубической решеткой типа NaCl), α -W с объемно-центрированной кубической решеткой, а также следы W₂C-фазы с гексагональной решеткой.

Использование с целью исследования макродеформированного состояния способа многократных наклонных съемок позволило установить, характерную для конденсатов закономерность: стабильное до высоких температур состояние (W, Ti)С твердого раствора наблюдается в конденсатах, подверженных действию высокой деформации сжатия. Этому состоянию отвечают конденсаты, полученные при низкой температуре осаждения (300 °С и менее) на всех типах подложек, а также конденсаты, нанесенные при высокой температуре на гладкие подложки с высоким КТР.

Автор выражает благодарность к.ф.-м.н, ведущему научному сотруднику Стеценко А.Н. за получение образцов ионно-плазменных конденсатов.

ЛИТЕРАТУРА

- Mayrhofer P.H., Mitterer C., Hultman L., Clemens H.//Progress in Materials Science. – 2006. – Vol. 51. – P. 1032.
- Sobol' O.V., Grigorjev O.N., Kunitsky Yu.A., Dub S.N., Podtelezhnikov A.A., Stetsenko A.N. //Science of Sintering. – 2006. – Vol. 38. – P. 63.
- Sobol' O.V.// Functional Materials. 2006. Vol. 13(4). – P. 577.
- Sobol'O.V.//Phisics of the Solid State. 2007. Vol. 49(6). – P. 1161.
- 5. Sobol' O.V., Sobol' E.A., Podteleznikov A.A.// Functional materials. – 1999. Vol. 6(5). – P. 868.
- Koutzaki S.H., Krzanowski J.E., Nainaparampil J.J.//Metallurgical and Materials Transactions A. – 2002. – Vol. 33(6). – P. 1579.
- Соболь О.В. Об общности структуры ионноплазменных конденсатов фаз внедрения со слоистой упаковкой атомов//Оборудование и технологии термической обработки металлов

и сплавов. ОТТОМ-5. Ч. 2. Харьков: ННЦ ХФТИ, ИПЦ "Контраст". – 2004. – С. 241-246.

- Sobol'O.V.//Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies. – 2006. – Vol. 4, № 3. – P. 707.
- 9. Горбачева Т.Б. Рентгенография твердых сплавов. М.: Металлургия, 1985. 103 с.
- Самсонов Г.В., Упадхая Г.Ш., Нешпор В.С. Физическое материаловедение карбидов.–К.: Наукова думка, 1974. – 456 с
- Козьма А.А., Соболь О.В., Соболь Е.А.// Вестник ХГУ, Серия "Физика". – 1999. – Вып. 440(3). – С. 149.
- 12. Shpak A.P., Sobol'O.V., Cheremskoy P.G., Kunytsky Yu.A., Stetsenko A.N.//Nanosystems,

Nanomaterials, Nanotechnologies. – 2006. – Vol. 4, N_{2} 2. – P. 412.

- Соболь О.В. Закономерности формирования структуры ионно-плазменных конденсатов в кластерном и нанокристаллическом состояниях//Оборудование и технологии термической обработки металлов и сплавов. ОТТОМ-7, Харьков: ННЦ ХФТИ, ИПЦ "Контраст". – 2006. – Т. 3. – С. 72-80.
- Sobol' O.V., Sobol' E.A., Gladkikh L.I., Gladkikh A.N.//Functional Materials.-2002. -Vol. 9 (3). P. 486.
- Sobol' O. V.//Fizika Metallov i Metallovedenie.–
 2001. Vol. 91(1). P. 63.

СТРУКТУРА, СУБСТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА НАПРУЖЕНИЙ СТАН НАНОКРИСТАЛІЧНИХ ІОНО-ПЛАЗМОВИХ КОНДЕНСАТІВ КВАЗІБІНАРНОЇ КАРБІДНОЇ СИСТЕМИ WC-ТІС О.В. Соболь

Методами ширококутової рентгенівської дифрактометрії та рентгенофлюоресцентного спектрального аналізу вивчено вплив складу матеріалу, що розпорошується, та температури осадження на фазовий та елементний склад, структуру, субструктурні характеристики та напружений стан іонно-плазмових покриттів квазібінарної системи WC-TiC.

STRUCTURE, SUBSTRUCTURE FEATURES, AND STRESS STATE IN QUASI-BINARY CARBIDE WC-TIC ION-PLASMA NANOCRYSTALLINE CONDENSATES O.V. Sobol'

Using X-ray diffraction and X-ray fluorescent spectral methods the effects of sputtered material and deposition temperature on the phase and element composition, structure, substructure features, and stress state in the ion-plasma quasi-binary WC-TiC coatings.